

最先端計測共用ネットワークが加速する産官学連携ナノ材料研究

日時：2016年6月15日(水) 9:00~11:40

場所：仙台国際センター会議棟3F白檀(E会場)

※参加には日本顕微鏡学会第72回学術講演会への参加登録(参加費あり)が必要です。

参加登録はこちらから：<http://www.microscopy.or.jp/conf2016/>

問合せ先：微細構造解析プラットフォーム推進室

電子メールアドレス：acnp@nims.go.jp

文部科学省研究振興局参事官 (ナノテクノロジー・物質・材料担当)

西條正明様 ご挨拶

藤田武志 東北大学

「貴金属・レアースフリーのナノポーラス排ガス触媒の開発」

上原雅人 産業技術総合研究所

「ナノ粒子材料の開発と電子顕微鏡観察」

熊本明仁 東京大学

「単原子層偏析を伴う金属/セラミックス界面の原子分解能STEM-EDSマッピング」

長山咲子 日立マクセル株式会社

「透過電子顕微鏡によるLiCoO₂劣化観察」

山下任 産業技術総合研究所・昭和電工(株)

「電子顕微鏡法を用いた4H-SiCエピタキシャルウェーハ中の結晶欠陥の構造解析」

保田英洋 大阪大学

「クライオ電子顕微鏡法によるナノバブル水の解析」

懸橋理枝 大阪市立工業研究所

「アミドアミノキッド型界面活性剤のゲル化・増粘挙動 -会合体構造のCryo-TEM観察」

田中啓一 株式会社日立ハイテクサイエンス

「SEM/STEM-TES(Transition Edge Sensor)を用いた材料分析」

網野岳文 新日鐵住金株式会社

「酸素ガス導入による電子顕微鏡内の炭素コンタミ抑制」

藤田大介(微細構造解析プラットフォーム運営責任者) 総括